

ELEMENTE, METALLE


Parameter	Verfahren	Referenzmethode	Bestimmungsgrenze		Akkreditiert nach ISO 17025
			Wasser, Eluat [mg/L]	Feststoff [mg/kg TS]	
Aluminium	Al	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Antimon	Sb	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.1	1
Arsen	As	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.05	0.5
Bor	B	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Barium	Ba	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Beryllium	Be	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Bismut	Bi	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.1	1
Blei	Pb	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.05	0.5
Cadmium	Cd	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Calcium	Ca	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.05	0.5
Cobalt	Co	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Chrom _{gesamt}	Cr	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Chrom (VI)	Cr ⁶⁺	Fotometrie	DIN 38405	0.002	0.02
Eisen	Fe	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Gallium	Ga	ICP-OES	EN ISO 11885	0.01	0.1
Indium	In	ICP-OES	EN ISO 11885	0.1	1
Kalium	K	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Kupfer	Cu	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Lithium	Li	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.05	0.5
Magnesium	Mg	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Mangan	Mn	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Molybdän	Mo	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Natrium	Na	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05
Nickel	Ni	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1
Phosphor	P	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.1	1



Die Schwermetall- und Element-Analytik mittels ICP-OES ist bis zur angegebenen Bestimmungsgrenze akkreditiert.

Tiefere Bestimmungsgrenzen mittels ICP-MS auf Anfrage (noch nicht akkreditiert, in Validierung)

ELEMENTE, METALLE





Parameter	Verfahren	Referenzmethode	Bestimmungsgrenze		Akkreditiert nach ISO 17025	
			Wasser, Eluat [mg/L]	Feststoff [mg/kg TS]		
Quecksilber	Hg	KD-AFS	EN ISO 17852	0.0001	0.005	 Die Schwermetall- und Element-Analytik mittels ICP-OES ist bis zur angegebenen Bestimmungsgrenze akkreditiert. Tiefere Bestimmungsgrenzen mittels ICP-MS auf Anfrage (noch nicht akkreditiert, in Validierung)
Quecksilber	Hg	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.02	0.2	
Schwefel	S	ICP-OES	EN ISO 11885	0.1	1	
Selen	Se	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.1	1	
Silber	Ag	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05	
Silicium	Si	ICP-OES	EN ISO 11885	0.05	0.5	
Strontium	Sr	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05	
Titan	Ti	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1	
Thallium	Tl	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.1	1	
Vanadium	V	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.01	0.1	
Zink	Zn	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.005	0.05	
Zinn	Sn	ICP-OES / -MS	EN ISO 11885 / 17294-2	0.05	0.5	

Anzahl pro Probe	Preis CHF (exkl. MwSt.)	Anzahl pro Probe	Preis CHF (exkl. MwSt.)
1 Element	75.00	jedes weitere Element	15.00
2 Elemente	135.00		
3 Elemente	180.00		
4 Elemente	220.00		
5 Elemente	260.00		

Spezialpreise

Quecksilber	KD-AFS	100.00
Chrom (VI)		100.00
Schwefel		100.00

METALL-SCREENING halbquantitativ

Beschrieb	Verfahren	Preis CHF (exkl. MwSt.)	Akkreditiert nach ISO 17025
SM-Screening ohne Hg	ICP-OES	250.00	
SM-Screening inkl. Hg	ICP-OES / KD-AFS	300.00	
Element-Screening ohne Hg	ICP-OES	300.00	
Element-Screening inkl. Hg	ICP-OES / KD-AFS	350.00	
Matrix-Elemente	ICP-OES	250.00	